PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-160349

(43)Date of publication of application: 03.06.1992

(51)Int.Cl.

G01N 21/35

(21)Application number: 02-285734

(71)Applicant: NKK CORP

(22)Date of filing:

25.10.1990

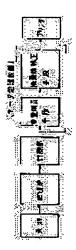
(72)Inventor: MATSUMARU NAOTO

AKIYOSHI TAKANORI SUGIMOTO KAZUMASA

(54) APPARATUS FOR SIMULTANEOUS ANALYSIS OF C AND S

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the degree of accuracy and, in addition, to enable analysis of the quantity of C and the quantity of S in a wide component range without changing conditions of measurement, by providing a weight correcting means for measured values and a means of correcting a working curve in accordance with the measured values subjected to the weight correction. CONSTITUTION: A sample weighed by a balance is put in a crucible made of ceramics and burnt in an oxygen flow. At this time, carbon and sulfur in the sample are turned into CO2, CO and SO2 and they are carried by the oxygen flow and led to a non- dispersive infrared detector (measuring element). Herein the concentration of gas is measured and the quantities of C and S are calculated from the concentration of gas. Next, the entire concentration areas of C and S are divided by a weight correcting means, and with a difference between the average measured values of C and S in a sample of a standard weight in each discrete concentration area and the average measured values of C and S of a sample of an arbitrary weight smaller than the standard weight, used as a deviation number, the weight correction of the measured values is executed. By a working curve correcting means, subsequently, correction of a working curve is executed in accordance with the measured values subjected to the weight correction, on the basis of a plurality of working curve coefficients corresponding to the concentration areas of C and S.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

卯特許出願公開

平4-160349 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)6月3日

G 01 N 21/35

7529-2 J Z

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

CおよびS同時分析装置

顧 平2-285734 ②特

頭 平2(1990)10月25日 ☎出

@発 明 松 丸 直

巨

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

②発 明 則

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

何発 明

和

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

何出 頭

日本鋼管株式会社

弁理士 苫米地 正敏 70代理

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

1、発明の名称

CおよびS同時分析装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 燃焼-赤外線方式によるCおよびS同時分析 装置において、CおよびSの会温度領域を分割 し、分割された各個別の機度領域における標準 重量の試料のCおよびSの平均測定値と前記標 **地重量よりも小さい任意の重量の試料のCおよ** びSの平均測定値との差を偏数として実測定値 の重量補正を行う重量補正手段と、CおよびS の接度領域に応じた複数の検量線係数に基づき、 前記載量補正された測定値に応じて検量線補正 を行う検量線補正手段とを備えたCおよびS同 時分析裝置。
- (2) 燃焼-赤外線方式によるCおよびS間時分析 袋置において、CおよびSの全濃度領域におけ る標準重量の試料のCおよびSの平均測定値と 前記標準重量よりも小さい任意の重量の試料の CおよびSの平均別定位との差ェに関する重量

推正式 f(z)=yにより実満定値の賃量補正を 行う重量補正手段と、CおよびSの濃度領域に 応じた複数の検量線係数に基づき、前記重量機 正された測定値に応じた検量線補正を行う検量 織補正手段とを備えたCおよびS同時分析装置。

3、発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

この発明は、第中のC重およびS重を同時に遡 定することができる赤外線-燃焼方式によるCお よびS同時分析装置の改良に関する。

〔從来の技術および解決すべき無題〕

従来一般に用いられている赤外線-燃焼方式に よるCおよびS同時分析装置は、通常試料として 切粉が用いられ、秤量範囲を1g± 0.2g程度と して分析が行われるようになっている。

しかし、この種の分析では、試料として打ち抜 き材料が用いられる場合があり、このような試料 は、その重量が0.5~0.7g程度であることから、 標準品(1g± 0.2g)で罰定した場合に較べ、 食量による基から正確度が悪くなるという簡単が

ある.

第1表に、1gの試料で限定を行った場合の正確さと、0.5gの試料で限定を行った場合に必要となる重量補正量の一例を示す。

第 1 表

	C(炭素)			S (硫黄)			
İ	St	Ellt	114E	St¶	£覆2	RENE	
	(ut%)	(#t%)	(%)	(utg)	(ut%)	(%)	
JSS 023-7	0.122	0.1208	1.2	0.0213	0.0204	1.8	

St値: スタンダ-ド値

この種の分析では、CおよびSともに正確さは 2 g以内とし、重量補正はCで1%以内、Sで1, 5%以内が目標であり、第1表に示されるように、 佐来装置はこのように目標を満足するものではな かった。

また、従来の装置では、同一測定条件にもかかわらず、CおよびSともに低値 (ppmオーダー) から高値まで検量線を区別しなければならず、第2表に示すように測定決度に合わせ分析方法を変えていた。

と前記標準重量よりも小さい任意の意量の試 料のCおよびSの平均測定値との差を優数と して実測定値の重量補正を行う重量補正手段 と、CおよびSの譲度領域に応じた複数の検 量線係数に基づき、前記重量補正された測定 値に応じて検量線補正を行う検量線補正手段 とを備えたCおよびS同時分析装置。

(2) 燃焼・赤外線方式によるでおよびS同時分析装置において、CおよびSの全濃度領域における領域重量を付いておよびSの全濃度領域均定値と前記標準重量よりも小さい任意のでは、Cといいでは、Cとのでは、Cとのでは、Cとのでは、Cとのでは、Cとのでは、Cとのでは、Cとのでは、Cといいでは、Cとのでは、

〔作用〕

第1回は本発明の基本構成図である。天秤で秤

第 2 表

C(炭漿)				S (硫黄)			
*	度	方	法	3	度	方	法
100рря	it	T ,	4	100ррі	127	ı	E
100ррп	-0.5≴	1	з.	100ррі	-0.06%	! 1	В
0.5-1.	05	(5	0.06-0	3%		D

1) A、Bは別装置で割定

ii) B、C、Dは同一装置で検量線 を変更して測定

本発明はこのような従来の問題に鑑みなされたもので、例定値の正確度が高く、しかも測定条件を変えることなく広い成分範囲のC量、S量を分析測定することができる装置の提供をその目的とする。

(銀額を解決するための手段)

このため本発明の装置は、つぎのような構成を 有する。

(I) 燃焼-赤外線方式によるCおよびS間時分 析装置において、CおよびSの全濃度領域を 分割し、分割された各個別の濃度領域におけ る標準重量の試料のCおよびSの平均測定値

量された試料は、磁製ルツボに投入され、このルツボを燃焼炉にセットし、試料を酸素気流中にで燃焼させる。この時、試料中の炭素、現黄は二酸化炭素(CO)、二酸化硫黄(SO。)に変換され、酸素気流に整送されて、非分散赤外線検出器(計測部)に導かれる。上記はガスは、CO。、CO、SO。の各検出島によりガス量が排出される。データ処理装置では、重量補正手段と検量線補・正手段により上記測定値の重量補正と検量線補・正がなされる。

第2回はこのような補正処理のフローを示すものである。データ処理装置は測定条件に対応した複数の校正式、重量補正テーブルを有しており、測定条件に応じて校正式、重量補正テーブルを選択し、での組み合わせを決める。 そして、まず従来と同様に、校正式マロA X + B によりC およびS の関定値(以下C / S 値と記す)の標準化を行い、

(C/S値)を得る。

次いで、重量補正手段による重量補正を行う。 重量補正手段は、重量補正テーブル処理に基づい て愛量補正を行うテーブル処理方式と、重量補正 式に基づいて重量補正を行う関数処理方式とがあ

このうちテーブル処理方式は、CおよびS重の 全濃度領域をいくつかに分割し、これら個別の識 皮域毎に、標準重量(例えば、1g)の試料の平 均測定値と前記標準重量よりも小さい任意の重量 (例えば、0.5g)の試料の平均測定値との差を 係数として重量補正を行うものである。この方式 では、重量補正手段は、前記各濃度域に応じた偏 数の重量補正テーブルを有しており、測定値(C ノS値)の適度に応じた偏数を用い、下記変換式 による重量補正によって測定値(C/S値)"が得 Sha.

例えば、1g(標準重量)の試料と0.5gの試

定値(C/S値)^{′′′}、すなわち、分析値に変換され

検査線補正手段は、C、Sの濃度領域に応じた 複数の検量線(係数)を有しており、その検量線 補正テーブルによりデータ変換がなされる。例え ば、第4回に示すように、上記重量補正された測 定値(C/S値)"の強度に応じての~④のいずれ かの検量線を用いて(C/S値)"が求められる。 (実施例)

テーブル処理方式の重量補正手段を有する本発 明装置と、従来の装置による分析値の正確度およ び重量補正値を第3表に示す。

同表からも明らかなように、本発明装置によれ ば、重量補正はCで1%以内、Sで1.5%以内で あり、正確さは従来設置に較べ大幅に向上してい

料の各平均値の差を偏数として用いる場合を例に とると、第3回に示すように、1gと0.5gの試料 の適度(平均額定値)差の傾きは。

$$(C/S値)" \times \frac{Z}{100} \times \frac{1}{1-0.5}$$
$$= \frac{Z}{50} \times (C/S値)"$$

であり、切片をBとすると、

$$(C/S$$
植) $'=\frac{Z}{50} \times (C/S$ 植) $'' \times W + B$
 $(C/S$ 植) $'' = \frac{Z}{50} \times (C/S$ 植) $'' \times 1 + B$

が成立ち、したがって、上記(1)式により (C/ S値)を求めることができる。

また、関数処理方式では、C、S番の全濃度領 城における、標準重量(例えば、1g)の試料の 平均割定値と前記標準重量よりも小さい任意の重 量 (例えば、0.5g)の試料の平均制定値との差 z に関する重量補正式 f(x)=yにより重量補正が 行われる。

以上のようにして重量補正された誘定値は、検 登録補正手段により補正された検量線に基づき間

Æ	<u> </u>	:		<u> </u>	
	京米	2.3	•	-1.2	
正備은 (vt5)	本额明	0.0015	-	0.0150	
计幅点	铁来	0.0013	1	0,0156	
M N	(412)	0.0015	•	0.0149	
制作(3)	本発明	1.0-	-0.3	0.4	

	S (製版)	正確さ(*1%)	小	0.0015		0.0150
	S	機工	铁米	0.0013	,	0.0156
		St	(41%)	0.0015 0.0013 0.0015	•	0.4 0.0149 0.0156 0.0150
ののない		重量補正(%)	本発明	-0.4	-0.3	
	C (炭漿)	重量	徒来	-1.5	-2.3	1.5
		C (投票) 正確さ(uts)	能来 本発明 世来 本発明	0.8652 0.8610 -1.5	0.0521 0.0502	0.1841
				0.8652	0.0521	JSS 030-5 0.186 0,1810 0.1841
		St	(etS)	98.0		0,188
		查语以交		1SS 611-8	JSS 201-10 0.05	030-5
		李		388	SS	SSC

また、複数の検量線を登録できることから、認 定法を第4表に示すように簡素化することができ た。

 第 4 表

 C(検査)
 S(確食)

 適度
 方法
 適度
 方法

 100ppaまで
 A
 100ppaまで
 B

 100ppa~0.5%
 B
 100ppa~0.06%
 B

 0.5~1.0%
 B
 0.06~0.3%
 B

(発明の効果)

以上述べた本発明によれば、試料食量が0.5~0.7g程度でも高い正確度の分析値が得られ、加えて同一調定条件では、分析方法を変えることなく 例定を行うことができ、従来に較べ分析作業を簡 業化することができる。

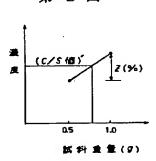
4. 固面の簡単な説明

第1回は本発明の基本構成回である。第2回は本発明装置による補正処理フロー回である。第3 国はテーブル処理方式による重量補正の原理を示すグラフである。第4回は本発明装置に登録される検量線の一例を模式的に示したものである。

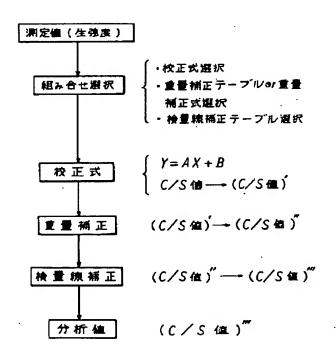
新 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 🗵

